



OIP 系列光隔离探头采用独家 SigOFIT™光隔离技术，精确解决存在大共模电压情况下的高带宽以及高电压差分信号问题，在其带宽范围内提供一流的共模抑制性能，为您提供最佳的隔离测量解决方案。

特点：

- 100MHz 带宽
- 高达 160dB 的共模抑制比
- 1.5% 测量精度
- 1mVrms 左右的噪声
- 采用尺寸小，连接稳定安全的 SMA 接头
- 差分电压可达 $\pm 1250\text{Vpk}$
- 共模隔离电压高达 50kVpk

高精度的测量结果

OIP 系列光隔离探头可以提供 1.5% 的高测量精度，最大程度保证了信号的完整性，是您最佳的测量方案选择。

氮化镓与碳化硅测试的不二之选

OIP 系列光隔离探头通过光学隔离几乎消除了共模干扰，凭借其高共模抑制比、短测量环路、高共模范围低衰减倍数，相比于使用差分探头，可以大大减少测量时产生的震荡和噪声。

应用场景：

- 氮化镓、碳化硅、IGBT 半 / 全桥设备的设计与分析
- 逆变器、UPS 及开关电源的测试
- 高压高带宽测试应用的安全隔离测试
- 宽电压、宽带测试应用
- 各种浮地测试

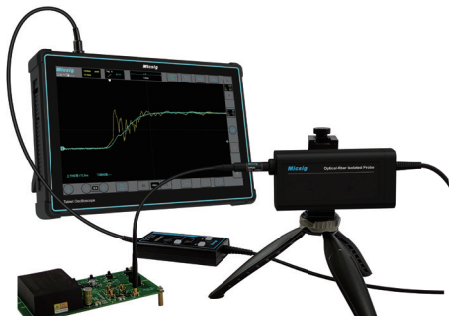
高可靠的连接方式

OIP 系列光隔离探头采用 SMA 高质量微波高频连接器，其尺寸小，连接稳定，可以最大程度上保证连接的可靠性。

极其便捷与轻松的测量体验

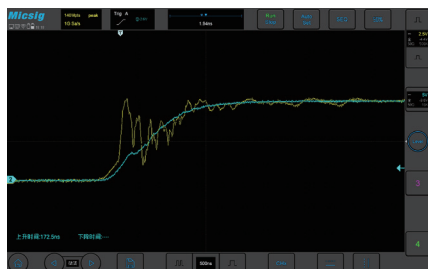
OIP 系列光隔离探头光 - 电还原器采用示波器 USB 端口供电，电 - 光转换器采用自身电池供电，可以持续工作 10 小时以上，无额外适配器，配合麦科信 TO 系列平板示波器，可以获得极其便捷与轻松的测量体验。

最准确的 GaN 和 SiC 表征



最佳的信号完整性

- 1.5% 测量精度
- 高达 160dB 的共模抑制比
- 1mVrms 左右的噪声



解决传统差分探头测量时的困扰

- 更小的震荡与噪声
- 高共模电压时，依然可以通过小衰减比的探头前端提高测量的精度



高可靠性连接

- 采用 SMA 连接，尺寸小，连接稳定
- 可保证最小测量环路
- 通过不同衰减比的衰减器，可测差分电压可达 $\pm 1250\text{Vpk}$

型号	OIP100B			
频宽	100MHz			
上升时间	$\leq 3.5\text{ns}$			
供电接口	USB 接口			
精度	1.5%			
噪声	1mVrms			
传播延迟	15ns			
测试电压	1X: $\pm 2.5\text{V}$	10X: $\pm 25\text{V}$	20X: $\pm 50\text{V}$	500X: $\pm 1250\text{V}$
共模电压	50kV 峰值			
输入阻抗	SMA 输入: $1\text{M} \parallel 7\text{pF}$ OP20: $4.21\text{M}\Omega \parallel 4.7\text{pF}$		OP10: $4.47\text{M} \parallel 4.5\text{pF}$ OP500: $12.7\text{M} \parallel 3.8\text{pF}$	
共模抑制比 (SMA 输入)	DC: 160dB	1M: 120dB	100M: 80dB	
共模抑制比 (OP10 输入)	DC: 160dB	1M: 115dB	100M: 80dB	
共模抑制比 (OP20 输入)	DC: 160dB	1M: 110dB	100M: 75dB	
共模抑制比 (OP500 输入)	DC: 160dB	1M: 90dB	100M: 45dB	

Micsig

深圳麦科信科技有限公司

电话: 0755-88600880

邮箱: sales@micsig.com

网址: www.micsig.com.cn

深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 A 栋一楼